



会员信息服务

[会员登陆与申请](#)[会费查询](#)[在线交纳会费](#)

机构信息服务

机构编号: 密码:

信息查询

新闻信息查询

搜索类型: 新闻性质: 关键字:

个人会员查询

专业: 地域: 姓名:

中国电子学会第十四届青年学术年会暨“电子产品制造与质量可靠性论坛”征文通知

发布时间: 2008-5-7 15:13:00 新闻来源: 学会总部 发布人: zhuhong

(大会网站<http://cieyc2008.ceprei.com>)

主办单位: 中国电子学会
 承办单位: 中国电子学会青年工作委员会
 信息产业部电子第五研究所
 电子元器件可靠性物理及其应用技术国家级重点实验室
 协办单位: IEEE 电子器件协会广州分会
 《电子产品可靠性与环境试验》杂志社
 信息产业部电子元器件失效分析协作网
 华南理工大学
 广东工业大学

中国电子学会第十四届青年学术年会(简称:CIE-YC'2008)将于2008年9月在广州召开。这是一次广泛团结广大青年科技工作者,促进电子信息及其相关学科青年学者学术交流的盛会,届时将邀请国内学术和产业界著名专家学者作综述或专题报告,大会论文集将由正规出版社出版,在参会宣读论文中评选优秀论文并推荐到核心科技期刊上发表。大会将利用“珠三角”电子信息产业优势与产业互动,会议期间将举办“失效分析在提升产品质量中的作用”和“电子产品生产质量与控制”技术培训,并组织在广东地区参观学习。

征文范围(但不限于这些领域)

1. 电子产品可靠性与环境适应性技术
2. 电子产品设计、制造与过程控制
3. 微电子与电子器件技术(微电子、元器件、光电子)
4. 电路与系统
5. 自动控制技术
6. 信息与通信技术
7. 计算机与软件工程
8. 多媒体技术

来稿要求

1. 内容具体,突出作者的创新与成果,具有较重要的学术价值和应用推广价值,未在国内外公开发行的刊物或会议上发表或宣读。

2. 第一作者年龄不超过45岁,文末附不超过100字的第一作者简介。

3. 投稿形式为电子邮件附件投稿。投稿邮箱为:cieyc2008@ceprei.com和cieyc2008@126.com(为确保您的信件如期到达,请两个邮箱同时发送),请在邮件标题中注明征文和所属专题字样,邮件中注明作者通讯地址、邮编、联系电话。

4. 每篇论文篇幅限为4页。寄送论文请用WORD排版,论文格式及排版要求见

<http://cieyc2008.ceprei.com>。

重要时间及联系方式

论文递交截止日期: 2008年5月30日

论文录用通知: 2008年6月30日前发出

会议时间: 2008年9月下旬

通讯地址: 广州市天河区东莞庄路110号 信息产业部电子五所重点实验室 邮编: 510610

联系人: 崔晓英、何玉娟 电话: 020-87237935, 87237715 传真: 020-87237185